1P-04

多波長・多方向光源下の単一偏光画像からの表面素材識別

倉知 美帆 川原 僚 岡部 孝弘 九州工業大学情報工学部

1 はじめに

物体表面の素材や状態の識別は,外観検査の自動 化や質感の認識おいて重要である.画像に基づくア プローチでは,非破壊かつ非接触で画素ごとの識別を 実現することができる.

画像における各画素の輝度値は,被写体の素材に固 有な性質である表面粗さや分光反射率に依存する.表 面粗さの異なる素材では,特定の光源方向から照明し たときに観察される明るさが異なることがある.ま た,分光反射率の異なる素材では,特定の波長の光源 で照明したときに観察される明るさが異なることが ある. Wang ら [1] は,表面粗さや分光反射率の違い を捉えて素材を識別するために,多波長・多方向光 源の明るさを最適化する手法を提案している.

また, 光の振動方向の偏り, つまり, 偏光を利用す ることで, 素材の性質を捉えられる. 一般に物体表面 からの反射光は偏光しており, その偏光状態は, 鏡面 /拡散反射率や屈折率など, 素材に固有な性質に依存 する. Wolff ら [2] は, 偏光を手掛かりに抽出した鏡面 反射成分の強度に着目して, 金属と誘電体を識別して いる. 反射成分分離では, 直線偏光板を透過した反 射光に含まれる拡散反射成分と鏡面反射成分の混合 比が, 偏光板の向きに依存して変化することを利用 している.

そこで本稿では、照明環境の工夫に加え偏光情報 を活用することで、素材識別を行う手法を提案する. 様々な光源色、光源方向における被写体の偏光画像を 学習することで、素材の分光反射率や表面粗さに加 え、鏡面/拡散反射率や屈折率を捉える.これにより、 分光反射率と表面粗さの類似した素材や鏡面/拡散 反射率と屈折率の類似した素材の識別においても精 度を向上させる.さらに、本手法では、光源の明るさ に非負制約を課すことで、ワンショットの識別を実現 する.そのため、提案手法はベルトコンベア上の動物 体などにも適用可能である。

2 提案手法

本研究では、学習・識別に、ライトステージの下で モノクロ偏光カメラを用いて撮影した画像を使用す る.具体的には図1のように撮影する.図1の右に示 す、多波長・多方向光源(ライトステージ)は、多波長 のLED クラスタが多方向に配置されており、各光源 を制御することで、中心にある被写体を様々な方向か ら様々な色で照らすことができる.また、反射光の偏 光状態を画像として取得するため、ライトステージ上 方に設置したモノクロ偏光カメラを用いて被写体を



図 1: 撮影環境

撮影する.物体表面上のある点をモノクロ偏光カメ ラで撮影すると,1つの画素について,水平面に対し て,0°,45°,90°,135°の4偏光成分の輝度値が得られ る.

ある点において, *L* 個 (*L* = *C* 色 × *D* 方向) の光 源を,明るさを 1 として,順に点灯したときに *i* 番 目の角度の偏光成分を並べた *L* × 1 のベクトルを x_i とする. 4 偏光成分を結合した 4*L* 次元のベクトル ($x_1^T, x_2^T, x_3^T, x_4^T$)を特徴とし,この 4*L* 次元の空間を 特徴空間という.本手法では,この特徴空間を線形な 識別面により分けることで,素材識別を実現する.

L 個の光源の明るさが $\boldsymbol{w} = (w_1, w_2, \dots, w_L)^T$ で あるとき, *i* 番目の角度の偏光成分の輝度値 I_i は重ね 合わせの原理により,

$$I_i = \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i \tag{1}$$

のように表される. さらに, 偏光成分の重み *w*^{*i*}_{*i*} により *I*^{*i*} を線形結合すると,

$$I' = \sum_{i=1}^{4} w'_{i} I_{i} = \sum_{i=1}^{4} w'_{i} \boldsymbol{w}^{T} \boldsymbol{x}_{i}$$
(2)

が得られる. バイアス項 b を付加して全体をゼロと たもの

$$I' + b = \sum_{i=1}^{4} w'_i \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + b = 0$$
(3)

は 4L 次元特徴空間における超平面であり, この超平 面を線形識別面とみなす.

式 (3) より, 線形識別面を表す結合係数が, 光源強 度 w と偏光成分の重み w'_i で記述されることから, こ れらをマージン最大化に基づいて求める. 具体的に は式 (4) によって定式化される最適化問題を解く. こ こで, y_n , ξ_n , N, α は正解ラベル, スラック変数, 学習 サンプルの数, ペナルティ項の重みである. 式 (7) に より光源強度に非負値制約を課すことで, ワンショッ トからの材質識別を実現する.



図 2: 識別対象となる4種類のプラスチック

$$\min_{\boldsymbol{w}, w'_i, b, \xi_n} \left[\frac{1}{2} |\boldsymbol{w}|^2 \left(\sum_{i=1}^4 {w'_i}^2 \right) + \alpha \sum_{n=1}^N \xi_n \right] \quad (4)$$

subject to

$$y_n\left[\boldsymbol{w}^T\left(\sum_{i=1}^4 w'_i \boldsymbol{x}_i\right) + b\right] \ge 1 - \xi_n, \quad (5)$$

$$\xi_n \ge 0 (n = 1, 2, 3, \dots, N), \tag{6}$$

$$w_l \ge 0 (l = 1, 2, 3, \dots, L)$$
 (7)

一般の線形識別面の係数が独立であるのに対して, *x*_iの係数は互いに独立でないため,通常のソフトマー ジン SVM では解くことができない. そこで *w* と *w*'_i の一方を固定し,二次計画法を用いて交互に繰り返し 最適化する.導出される光源強度 *w* で,各光源を点灯 することで,識別する素材に適した照明環境となる. 最終的には,この照明環境下において撮影される単一 モノクロ偏光画像データを,最適化により得られた線 形識別面に当てはめることで,素材識別を行う.

3 実験

図 2 に示す, 4 種類のプラスチック, (a) アクリル (PMMA), (b) ペット (PET), (c)ABS 樹脂 (ABS), (d) ポリプロピレン (PP) を対象に実験を行った. 照明に は, 4 色 × 5 方向 の計 20 種類の光源を利用した.

まず, 図1に示す撮影環境において, 20種類の光源 下で被写体を撮影する.撮影画像は0°, 45°, 90°, 135° の4 偏光成分の輝度値を含み,各成分ごとの偏光画 像を取得できる. 各成分の偏光画像から得られる, 10×10の4 領域, 合計 400 画素を学習に,学習領域 とは異なる 20×20, 合計 400 画素をテスト領域とし て用いる.

次に, 光源強度 w と偏光成分の重み w'_i を最適化す る. このとき偏光成分の重みとバイアス項の初期値 を, それぞれ $w'_i = (1,1,1,1)^T$, b = 1 として光源強度 w から最適化を行う. その後, 得られた w を, 式 (4) において固定し, w'_i と b を最適化する. 今度は w'_i を 固定し, w を再び最適化する. このようにして, 交互 に繰り返し最適化する. 表 1 に, 提案手法, (i) 光源強 度のみを最適化したとき, および, (ii) 偏光成分成分 の重みのみを最適化したときの識別率を示す. また, アクリルとペット, ABS 樹脂とポリプロピレンの識 別において, 得られた光源強度を図 3 に示す.

表1より,全ての素材において良好な結果が得られた.照明環境のみ,あるいは偏光情報のみの最適化では,識別に限界がある素材,アクリルとペット,ABS

表 1: 識別率 [%]



図 3: 最適化された光源強度

樹脂とポリプロピレンの識別において、これらを組み 合わせることで、識別精度が向上することが分かる. 特に、アクリルとペットなど目視では識別が難しい、 つまり分光反射率などの性質が類似している素材の 識別においても高精度な結果となっており、本手法の 有効性が確認できる.また、図3より、提案手法では、 光源強度のみを最適化する場合に比べ、少数の光源で 識別が行える.

4 まとめ

本稿では,照明環境の工夫と偏光情報の活用によ り,素材識別を行う手法を提案した.具体的には,多 波長・多方向光源下における偏光画像を用いて学習 を行い,識別する素材に応じて,多波長・多方向の光 源強度と識別に用いる線形識別面を最適化する.こ れにより,ワンショットでの識別精度を向上させるこ とが確認できる.今後は,対象とする素材を増やし, 多クラス識別に取り組みたい.

謝辞 本研究の一部は, JSPS 科研費 JP20H00612 の 助成を受けた.

参考文献

- C. Wang and T. Okabe, "Joint optimization of coded illumination and grayscale conversion for one-shot raw material classification," In Proc, BMVC2017, 2017.
- [2] L. B. Wolff, "Polarization-based material classification from specular reflection," IEEE TPAMI, Vol.12, No.11, pp.1059–1071, 1990.